

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/031695 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01D 5/244,
18/00, 5/36

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/009796

(22) Internationales Anmeldedatum:
4. September 2003 (04.09.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
102 44 583.4 25. September 2002 (25.09.2002) DE

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HOFBAUER, Her-
mann [DE/DE]; Johann-Namberger-Strasse 46, 83308
Trostberg (DE). STRASSER, Erich [DE/DE]; Sonnen-
leite 17, 83308 Trostberg (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Veröffentlicht:

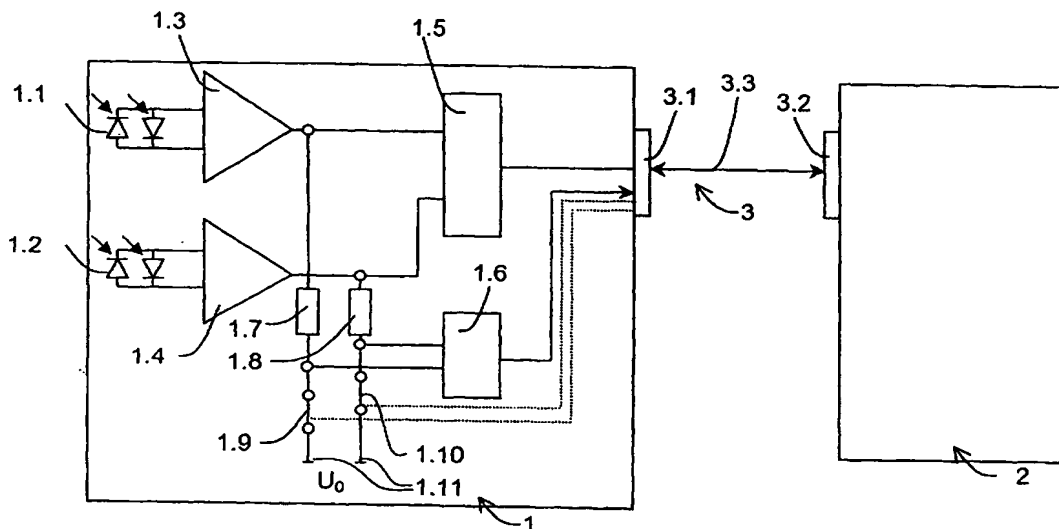
— mit internationalem Recherchenbericht

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH
[DE/DE]; Postfach 12 60, 83292 Traunreut (DE).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: MEASURING SYSTEM AND METHOD FOR THE FUNCTIONAL MONITORING THEREOF

(54) Bezeichnung: MESSSYSTEM UND VERFAHREN ZU DESSEN FUNKTIONSÜBERPRÜFUNG



(57) Abstract: The invention relates to a measuring system comprising a measuring device (1), another device (2) and a means for transmitting data (3) enabling bits of data to be transmitted between the measuring device (1) and the other device (2). The measuring device (1) also comprises a signal monitoring circuit (1.6) and a switch element (1.9, 1.10). The switch element (1.9, 1.10) is electrically contacted to a test potential source (1.11). The test potential source (1.11) is in contact with the signal monitoring circuit (1.6) according to a switch element state. The signal monitoring circuit (1.6) is also in contact with the means for transmitting data (3). The invention also relates to a method enabling functional monitoring of said measuring system in a monitoring mode wherein the test potential is applied.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]